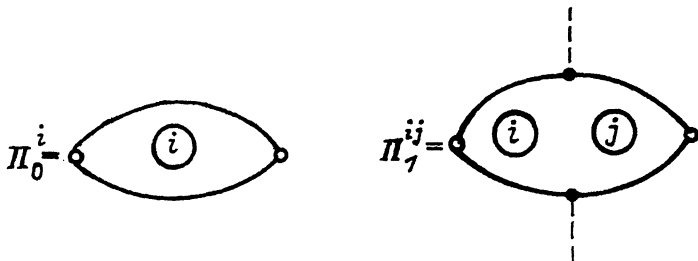


НЕЛИНЕЙНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ФОНОНОВ В СЛОИСТЫХ ПРОВОДНИКАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ ПОЛЯ

С.Е. Шафранюк

Проявляемый в последние годы повышенный интерес к слоистым проводящим структурам во многом вызван их практическим использованием в микроэлектронике. Слоистые проводники, представляющие собой систему слабосвязанных параллельных проводящих слоев, обычно создаются с помощью методик интеркалирования, послыонного напыления или эпитаксии [1, 2]. При этом элементы электронных схем, созданные на основе таких проводников, зачастую находятся под воздействием различных интенсивных электромагнитных полей. Ясно, что в данной ситуации они сами, как правило, становятся источниками вторичных излучений. В настоящей работе методом диаграммной техники для неравновесных процессов [3] рассмотрено явление вторичного излучения (нелинейной генерации) неравновесных акустических фононов образом слоистого проводника, находящимся под воздействием внешнего интенсивного электромагнитного поля частоты Ω . Изучен случай слабого взаимодействия электронов, принадлежащих различным слоям i и j , разделенных диэлектрическими прослойками толщиной $h_i \gg a$ (a — межатомное рассеяние в плоскости слоя), когда применим формализм гамильтониана перескоков [2] (эквивалентного туннельному гамильтониану [4] с матричным элементом перехода $T_{pp'}^{ij}$ между слоями i и j). Считается, что толщины слоев $d_i \sim a$, поэтому импульс p электронов двумерный, а рассматриваемые здесь длинноволновые фононы имеют нелинейный и существенно анизотропный закон дисперсии $\omega(\vec{q})$ (см. [5, 8]), определяющий, в частности, анизотропию взаимодействия фононов с электронами i -го слоя. Рассмотрим условия, в которых вектор напряженности СВЧ волны направлен перпендикулярно слоям и которые аналогичны условиям реализации эффекта Дайема-Мартина туннелирования электронов с участием фотонов в одиночном туннельном контакте сверхпроводников [6, 7]. Если размеры образца порядка длины СВЧ волны, межслойные закоротки отсутствуют и $T_{pp'}^{ij} \approx T_{pp'}^{i-j}$, то между слоями i и j возникает эффективное напряжение $\varphi_i(t) - \varphi_j(t) = (i-j)V \cos \Omega t$ (V — амплитуда напряжения между соседними слоями, $\varphi_i(t)$ — потенциал, создаваемый в i -ом слое СВЧ полем). Поляризационные операторы Π_0^i и Π_i^j , определяющие фонон-электронные взаимодействия, даны на рисунке. Сплошными линиями изображены электронные функции Грина-Келдыша [3], пунктиром — внешнее поле, i и j — индексы слоев, светлые кружки обозначают электрон-фононные вершины, а темные — вершины, отвечающие процессам перескоков электронов через слой под действием СВЧ поля:



$$\Gamma_{lm}^k = \beta_{lm} \sum_n J_n^2 \left(\frac{keV}{\Omega} \right) e^{in\Omega t} T_{pp'}^k, \quad (1)$$

где $\beta_{lm} = (\hat{G}_x)_{lm} / \sqrt{2}$, l и m - индексы Келдыша [3], $J_n(x)$ - функция Бесселя порядка n . Все диаграммы необходимо присуммировать по индексам Келдыша электронных линий и индексам слоев. В пределе $\Omega\tau_p \gg 1$, $qL_i \gg 1$ и $\tau_p > \tau_{p-l}$ ($\tau_p = \pi(V_S m^* |T^k|^2)^{-1}$ - эффективное время перескока; V_S - объем проводящего слоя; m^* - эффективная масса электрона; τ_{p-l} - время перепоглощения фонона; L_i - длина свободного пробега электрона в слое) методом [3] построено кинетическое уравнение для фононной функции распределения $N(\omega_q)$. Из данного уравнения найден спектр неравновесных фононов $G(\omega_q)$, генерируемых слоистым проводником под действием СВЧ поля при $\tau_{p-l} > \tau_{es}$ (τ_{es} - время вылета фононов из образца). Рассмотрим здесь наиболее интересный, на наш взгляд, случай воздействия импульсного поля с продолжительностью импульса τ_u , когда $\Omega \gg i\tau_u^{-1} \gg \tau_E^{-1}$ (τ_E - время энергетической релаксации электронов) и функция распределения f_E равновесна. При этом нелинейная полевая генерация (количественно определяемая теперь только операторами Π_i^{ij}) вызвана излучением фононов непосредственно в актах межслойных перескоков электронов и ее спектр имеет вид:

$$G(\omega_q) = \lambda_q \sum_{n, k > 1} |T^k|^2 J_n^2 \left(\frac{keV}{\Omega} \right) (n\Omega - \omega_q) \theta(n\Omega - \omega_q), \quad (2)$$

$$\lambda_q = \frac{1}{2} V_S \left(\frac{m^*}{\pi} \right)^2 q^2(\omega_q) \omega_q^2 |I(q, \omega_q)|^2, \quad (3)$$

$$I(q, \omega_q) = \frac{2i}{(\omega_q^2 - (V_F q)^2)^{1/2}} \operatorname{arctg} \frac{V_F q}{(\omega_q^2 - (V_F q)^2)^{1/2}}, \quad (4)$$

где V_F - фермиевская скорость. При выводе (2) считалось, что $T_{pp'}^k \approx T^k$, а слои эквивалентны. Оценим степень анизотропии $\mathcal{A} = G_p''(\omega) / G_p^+(\omega)$ спектра фононов частоты $\omega = \omega_q$, испускаемых

вдоль (//) и поперек (\perp) слоев. Полагая при этом $s_m \ll v_F$ (s_m - максимальное значение скорости звука), получим $\gamma \approx \approx (m_{\parallel} g(q_{\parallel}))^2 / (m_{\perp} g(q_{\perp}))^2$, где m_{\parallel} и m_{\perp} - компоненты эффективной массы электрона ($m_{\parallel} = m_{xx} = m_{yy}$; $m_{\perp} = m_{zz} \rightarrow \infty$), а константа электрон-фононного взаимодействия $g(q)$ вычислена в деформационной модели [9]: $g(\vec{q}) = -i \sum_{\alpha, \beta} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_{\alpha\beta}} \rho_{\alpha\beta}(\rho + q) \alpha_{\beta\alpha} q_{\beta} / (4m_{\alpha} \sqrt{2\rho\omega_q})$ ($\vec{e}(\vec{q})$ - единичный вектор поляризации, ρ - плотность материала).

Рассмотрим, в качестве примера, простую модель слоистого гексагонального кристалла, обладающего двумя типами акустических колебаний [5]: колебаний в плоскости слоев с законом дисперсии $\omega_{i2}^2 \approx (\alpha_3/M) a^2 q_{\parallel}^2 + (\alpha_1/M) \sin^2(hq_{\perp}/2)$ (здесь M - масса иона; $aq_{\parallel} \ll 1$; $\alpha_i = \alpha^{ik}(h\vec{n}^{\perp})$; $\alpha_3 = \alpha^{ik}(a\vec{n}^{\parallel})$ при $i, k = x, y$; $\alpha_2 = \alpha^{zz}(h\vec{n}^{\perp})$ - элементы силовой матрицы [5], \vec{n}^{\parallel} и \vec{n}^{\perp} - единичные векторы) и "изгибных" колебаний слоев с $\omega_{32}^2 \approx \alpha_1/M |h^2 q_{\parallel}^2 + \alpha_3/M |a^4 q_{\perp}^4 - (4\alpha_2/M) \sin^2(hq_{\perp}/2)$.

С учетом сказанного, имеем $\gamma \approx (q_{\parallel}/q_{\perp})^2 \approx [(\omega/a)^2 (M/\alpha_3)] / [(2/h)^2 \cdot \arcsin^2(\omega^2 M/4\alpha_2)]^{1/2}$, что для значений параметров, приведенных, например, в [5] для графита: $\alpha_2 = 10^5$ дин/см, $\alpha_3 = 0.6 \cdot 10^4$ дин/см $h/a \approx 2.5$ при $hq_{\perp} \ll 1$ дает $\gamma \approx 0.37$. Значительно более высокую степень анизотропии следует ожидать, например, в соединениях TaS_2 , интеркалированных молекулами пиридина, где анизотропия электронной проводимости достигает величины 10^5 [10]. Однако здесь возникает задача экспериментального определения параметров h, a и элементов силовой матрицы $\alpha^{ik}(\vec{n})$.

Рассмотренное явление, на наш взгляд, можно использовать при создании генераторов неравновесных фононов, а также следует учитывать при анализе работы элементов схем, обладающих слоистой структурой и находящихся под воздействием СВЧ поля. Проведенные оценки показывают, что исследование нелинейной генерации фононов позволяет получить информацию о параметрах перескоков τ^k и анизотропии дисперсии фононов.

Автор благодарен В.Г. Барьяхтару и В.П. Семиноженко за обсуждение результатов работы.

Л и т е р а т у р а

- [1] S a f r a n S.A. - Phys. Rev. Lett., 1980, v. 44, N 12, p. 937-940.
- [2] Г в о з д и к о в В.М. - ФТТ, 1983, т. 25, № 11, с. 3336-3340.
- [3] К е л д ы ш Л.В. - ЖЭТФ, 1964, т. 47, № 10, с. 1515-1527.
- [4] Туннельные явления в твердых телах. М.: Мир, 1973. 320 с.
- [5] К о с е в и ч А.М. Физическая механика реальных кристаллов. К.: Наукова думка, 1981. 328 с.
- [6] T i e n P.K., G o r d o n J. - Phys. Rev., 1963, v. 129, N 2, p. 647-651.

- [7] Семиноженко В.П., Шафранюк С.Е. - ФНТ, 1984, т. 10, № 3, с. 273-279.
- [8] Fomin V.M., Pokatilov E.P. - Phys. Stat. Sol. (b), v. 132, N 1, p. 69-82.
- [9] Tsuneto T. Phys. Rev., 1961, v. 121, N 2, p. 402-415.
- [10] Булаевский Л.Н. - УФН, 1975, т. 116, в. 3, с. 449-487.

Институт металлофизики
АН УССР, Киев

Поступило в Редакцию
21 июля 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 4

26 февраля 1988 г.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ПРОТЕКАНИЯ
В СМЕСЯХ ПРОВОДНИК-ДИЭЛЕКТРИК
ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА И СОБСТВЕННОЙ
ПОРИСТОСТИ ЧАСТИЦ ПРОВОДНИКА

С.И. Зиновьев, Р.В. Манчук,
Л.И. Сарин, И.А. Энтин

Для смесей проводник-диэлектрик в [1, 2] исследовалось влияние соотношения средних размеров частиц проводника \bar{a}_1 и диэлектрика \bar{a}_2 на порог протекания x_{ic} . Показано, что

$$\frac{dx_{ic}}{d\Gamma} \geq 0, \quad (1)$$

$$\Gamma = \frac{\bar{a}_1}{\bar{a}_2}.$$

Нами исследована зависимость порога протекания в смеси пековый кокс-портландцемент от Γ при фиксированной \bar{a}_2 . Порошок пекового кокса разделялся по фракциям на ситах, причем $\bar{a}_1 \approx \bar{a}_2 \approx 2 \cdot 10^{-5}$ м. Предполагалось, что распределение частиц проводника по размеру внутри фракций - равномерное, электропроводность смесей измерялась под давлением $P = 5 \dots 80$ МПа. Объемные концентрации компонентов x_i ($i = 1, 2$) рассчитывались как и в [1]:

$$x_i = \frac{m_i}{\rho_i \cdot V(P)},$$

где $V(P)$ - объем смеси, m_i - массы и ρ_i - плотности компонентов.